

泰氟龙烧蚀对黏性激波层电子密度的影响

唐锦荣, 彭世铨

中科院力学所, 100080

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 采用黏性激波层基本方程组对有无泰氟龙烧蚀两种情况下的钝锥体化学非平衡绕流作了数值求解, 以研究泰氟龙烧蚀对流场电子密度的影响规律. 算例结果表明: 泰氟龙烧蚀确有降低流场电子密度的效应. 平衡催化壁工况下这种效应的强度, 显著大于非催化壁工况下的强度; 远下游截面处的这种效应的强度, 显著大于驻点区的强度. 此外, 通过计算结果分析, 对形成上述影响规律的原因作了初步讨论.

关键词

分类号

中科院力学所, 100080

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(547KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [唐锦荣](#)
 - [彭世铨](#)